

Средняя стоимость типовых исследований
Федерального Центра коллективного пользования
«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

№ п/п	Наименование диагностического метода	Стоимость, руб. в час	Средняя продолжительность измерения, час	Стоимость проведения измерения, руб.
1	Отработка методов формирования и реконструкции равновесных магнитных конфигураций сложной формы на токамаке с дивертором Глобус-М	75 000	2	150 000
2	Исследование взаимодействия атомов высокой энергии с плазменной мишенью на токамаке с дивертором Глобус-М.	100 000	3	300 000
3	Рентгено-дифрактометрические исследования твердотельных веществ на высокоразрешающей рентгеновской станции Discover D8, Bruker	6 500	3	19 500
4	Рентгено-фазовые исследования материалов на порошковом рентгеновском дифрактометре D2 Phaser, Bruker	2 500	2	5 000
5	Исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии на JEM-2100F, Jeol	6 000	4	24 000
6	Проведение микроанализа на просвечивающем электронном микроскопе JEM-2100F, Jeol	8 000	2	16 000
7	Подготовка образцов для ПЭМ исследований	4 000	4	16 000
8	Исследования с помощью растровой электронной микроскопии на JSM-7001F, Jeol	5 000	1	5 000
9	Проведение микроанализа на растровом электронном микроскопе JSM-7001F, Jeol	5 500	1	5 500
10	Проведение исследований дифракции обратного	5 500	2	11 000

	рассеяния электронов на растровом электронном микроскопе JSM-7001F, Jeol			
11	Подготовка образцов для РЭМ исследований	4 000	1	4 000
12	Атомно-силовая микроскопия на сканирующем зондовом микроскопе Dimension 3100, Veeco	3 500	2	7 000
13	Исследования дефектов с глубокими уровнями в полупроводниковых гетероструктурах на установке нестационарной спектроскопии глубоких уровней (НСГУ - DLTS)	2 000	5	10 000
14	Исследования электрофизических свойств полупроводниковых гетероструктур на установке спектроскопии полной проводимости	2 000	5	10 000
15	Исследования на вторично-ионном микроанализаторе Ion Microanalyzer IMS-7F, Cameca	8 000	5	40 000
16	Измерение температурной зависимости вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик полупроводниковых приборов и гетероструктур	2 500	5	12 500
17	Исследование эрозионной стойкости материалов при их взаимодействии с импульсными плазменными потоками высокой плотности, создаваемыми плазменной пушкой	3 000	2	6 000

Руководитель ЦКП



С.Г. Конников